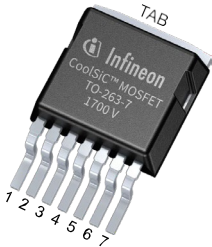


最终数据手册

英飞凌 CoolSiC™ 1700 V SiC 沟槽 MOSFET：碳化硅MOSFET

特性

- $V_{DSS} = 1700\text{ V}$ at $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$
- $I_{DDC} = 9.8\text{ A}$ at $T_c = 25^{\circ}\text{C}$
- $R_{DS(on)} = 450\text{ m}\Omega$ at $V_{GS} = 12\text{ V}$, $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$
- 针对反激式拓扑进行了优化
- 12 V / 0 V 栅极源电压与大多数反激式控制器兼容
- 开关损耗非常低
- 基准栅极阈值电压, $V_{GS(th)} = 4.5\text{ V}$
- 完全可控的 dv/dt , 用于 EMI 优化
- 降低系统复杂性
- 直接由反激式控制器驱动
- 提高效率并减少冷却工作量
- 实现更高的频率



-  Halogen-free
-  Green
-  Lead-free
-  RoHS

潜在应用

- 光伏组串逆变器
- 太阳能集中逆变器
- 工业级不间断电源（UPS）
- 工业开关电源
- 充电器

产品验证

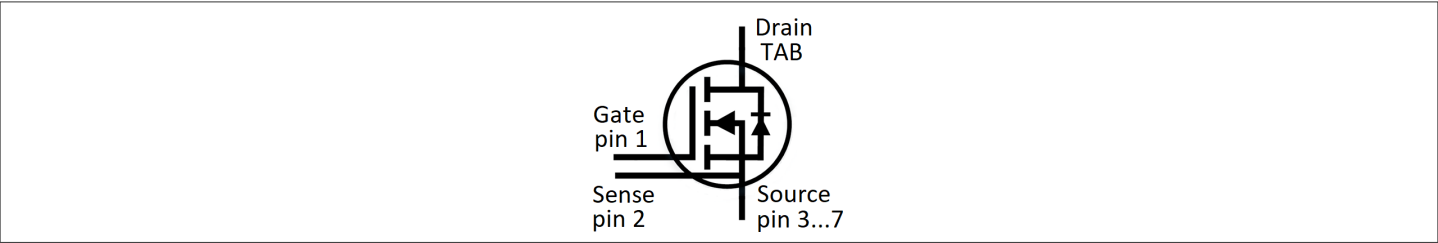
- 符合 JEDEC47/20/22 相关测试的工业应用要求

描述

引脚定义：

- Pin 1 - 栅极
- Pin 2 - 开尔文检测触点
- Pin 3...7 - 源极
- Tab – 漏极

注意：源引脚和感测引脚不可互换，互换可能会导致故障，建议仅用于正向操作模式



Type	Package	Marking
IMBF170R450M1	PG-TO263-7-U01	170M1450

本数据手册的原文使用英文撰写。为方便起见，英飞凌提供了译文；由于翻译过程中可能使用了自动化工具，英飞凌不保证译文的准确性。为确认准确性，请务必访问 infineon.com 参考最新的英文版本（控制文档）。



目录

	描述	1
	特性	1
	潜在应用	1
	产品验证	1
	目录	2
1	封装	3
2	MOSFET	3
3	体二极管 (MOSFET)	6
4	特性图	7
5	封装外形	12
6	测试条件	13
	修订记录	14
	免责声明	15

1封装

1 封装

表 1 特征值

Parameter	Symbol	Note or test condition	Values			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
Storage temperature	T_{stg}		-55		150	°C
Soldering temperature	T_{sold}	reflow soldering (MSL1 according to JEDEC J-STD-020)			260	°C
Thermal resistance, junction-ambient ¹⁾	$R_{th(j-a)}$				62	K/W
MOSFET/body diode thermal resistance, junction-case	$R_{th(j-c)}$			1.1	1.4	K/W

1) 含铅

2 MOSFET

表 2 最大额定值

Parameter	Symbol	Note or test condition		Values	Unit
Drain-source voltage	V_{DS}	$T_{vj} \geq 25\text{ °C}$		1700	V
Continuous DC drain current for $R_{th(j-c,max)}$, limited by $T_{vj(max)}$	I_{DDC}	$V_{GS} = 12\text{ V}$	$T_c = 25\text{ °C}$	9.8	A
			$T_c = 100\text{ °C}$	6.9	
Peak drain current, t_p limited by $T_{vj(max)}$ ¹⁾	I_{DM}	$V_{GS} = 12\text{ V}$		24.8	A
Gate-source voltage, max. transient voltage ²⁾	V_{GS}	$t_p \leq 0.5\text{ }\mu\text{s}$, $D < 0.01$		-10...23	V
Gate-source voltage, max. static voltage	V_{GS}			-7...20	V
Power dissipation, limited by $T_{vj(max)}$	P_{tot}		$T_c = 25\text{ °C}$	107	W
			$T_c = 100\text{ °C}$	53	

1) 已通过设计验证。

2) 重要提示：正、负栅极源电压的选择会影响器件的长期行为。

表 3 建议值

Parameter	Symbol	Note or test condition	Values	Unit
Recommended turn-on gate voltage	$V_{GS(on)}$		12...15	V
Recommended turn-off gate voltage	$V_{GS(off)}$		0	V

表4 **特征值**

Parameter	Symbol	Note or test condition		Values			Unit
				Min.	Typ.	Max.	
Drain-source on-state resistance	$R_{DS(on)}$	$I_D = 2\text{ A}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$, $V_{GS(on)} = 12\text{ V}$		450		mΩ
			$T_{vj} = 100\text{ °C}$, $V_{GS(on)} = 12\text{ V}$		638		
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$, $V_{GS(on)} = 12\text{ V}$		917		
			$T_{vj} = 25\text{ °C}$, $V_{GS(on)} = 15\text{ V}$		364	390	
Gate-source threshold voltage	$V_{GS(th)}$	$I_D = 2.5\text{ mA}$, $V_{DS} = V_{GS}$ (tested after 1 ms pulse at $V_{GS} = 20\text{ V}$)	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	3.5	4.5	5.7	V
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$		3.6		
Zero gate-voltage drain current	I_{DSS}	$V_{DS} = 1700\text{ V}$, $V_{GS} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		0.9	11	μA
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$		10		
Gate leakage current	I_{GSS}	$V_{DS} = 0\text{ V}$	$V_{GS} = 20\text{ V}$			100	nA
			$V_{GS} = -10\text{ V}$			-100	
Forward transconductance	g_{fs}	$I_D = 2\text{ A}$, $V_{DS} = 20\text{ V}$			0.9		S
Internal gate resistance	$R_{G,int}$	$f = 1\text{ MHz}$, $V_{AC} = 25\text{ mV}$			20		Ω
Input capacitance	C_{iss}	$V_{DS} = 1000\text{ V}$, $V_{GS} = 0\text{ V}$, $f = 1000\text{ kHz}$, $V_{AC} = 25\text{ mV}$			610		pF
Output capacitance	C_{oss}	$V_{DS} = 1000\text{ V}$, $V_{GS} = 0\text{ V}$, $f = 1000\text{ kHz}$, $V_{AC} = 25\text{ mV}$			16		pF
Reverse transfer capacitance	C_{rss}	$V_{DS} = 1000\text{ V}$, $V_{GS} = 0\text{ V}$, $f = 1000\text{ kHz}$, $V_{AC} = 25\text{ mV}$			1.7		pF
C_{oss} stored energy	E_{oss}	$V_{DS} = 1000\text{ V}$, $V_{GS} = 0\text{ V}$, $f = 1000\text{ kHz}$, $V_{AC} = 25\text{ mV}$			2.9		μJ
Total gate charge	Q_G	$V_{DD} = 1000\text{ V}$, $I_D = 2\text{ A}$, $V_{GS} = 0/12\text{ V}$, turn-on pulse			11		nC
Plateau gate charge	$Q_{GS(pl)}$	$V_{DD} = 1000\text{ V}$, $I_D = 2\text{ A}$, $V_{GS} = 0/12\text{ V}$, turn-on pulse			3.3		nC
Gate-to-drain charge	Q_{GD}	$V_{DD} = 1000\text{ V}$, $I_D = 2\text{ A}$, $V_{GS} = 0/12\text{ V}$, turn-on pulse			5.9		nC
Turn-on delay time	$t_{d(on)}$	$V_{DD} = 1000\text{ V}$, $I_D = 2\text{ A}$, $V_{GS} = 0/12\text{ V}$, $R_{G,ext} = 22\text{ Ω}$, $L_\sigma = 40\text{ nH}$, diode: body diode at $V_{GS} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$		27		ns
			$T_{vj} = 175\text{ °C}$		22		

(表格续下页.....)

表 4（续） 特征值

Parameter	Symbol	Note or test condition	Values			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
Rise time	t_r	$V_{DD} = 1000\text{ V}$, $I_D = 2\text{ A}$, $V_{GS} = 0/12\text{ V}$, $R_{G,ext} = 22\text{ }\Omega$, $L_\sigma = 40\text{ nH}$, diode: body diode at $V_{GS} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	20		ns
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$	16		
Turn-off delay time	$t_{d(off)}$	$V_{DD} = 1000\text{ V}$, $I_D = 2\text{ A}$, $V_{GS} = 0/12\text{ V}$, $R_{G,ext} = 22\text{ }\Omega$, $L_\sigma = 40\text{ nH}$, diode: body diode at $V_{GS} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	32		ns
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$	36		
Fall time	t_f	$V_{DD} = 1000\text{ V}$, $I_D = 2\text{ A}$, $V_{GS} = 0/12\text{ V}$, $R_{G,ext} = 22\text{ }\Omega$, $L_\sigma = 40\text{ nH}$, diode: body diode at $V_{GS} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	24		ns
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$	27		
Turn-on energy	E_{on}	$V_{DD} = 1000\text{ V}$, $I_D = 2\text{ A}$, $V_{GS} = 0/12\text{ V}$, $R_{G,ext} = 22\text{ }\Omega$, $L_\sigma = 40\text{ nH}$, diode: body diode at $V_{GS} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	76		μJ
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$	81		
Turn-off energy	E_{off}	$V_{DD} = 1000\text{ V}$, $I_D = 2\text{ A}$, $V_{GS} = 0/12\text{ V}$, $R_{G,ext} = 22\text{ }\Omega$, $L_\sigma = 40\text{ nH}$, diode: body diode at $V_{GS} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	15		μJ
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$	21		
Total switching energy	E_{tot}	$V_{DD} = 1000\text{ V}$, $I_D = 2\text{ A}$, $V_{GS} = 0/12\text{ V}$, $R_{G,ext} = 22\text{ }\Omega$, $L_\sigma = 40\text{ nH}$, diode: body diode at $V_{GS} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	91		μJ
			$T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$	101		
Virtual junction temperature	T_{vj}		-55		175	$^\circ\text{C}$

注: 为了获得最佳的使用寿命和可靠性，英飞凌建议运行条件不超过本数据手册中所述最大额定值的80%。

该芯片技术的特征高达200 kV/ μs 。测量的dV/dt 受到测量测试设置和封装的限制。

除非另有说明，特性曲线均为 $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ 时的数据。动态测

试电路见图F。

3 体二极管 (MOSFET)

表5 最大额定值

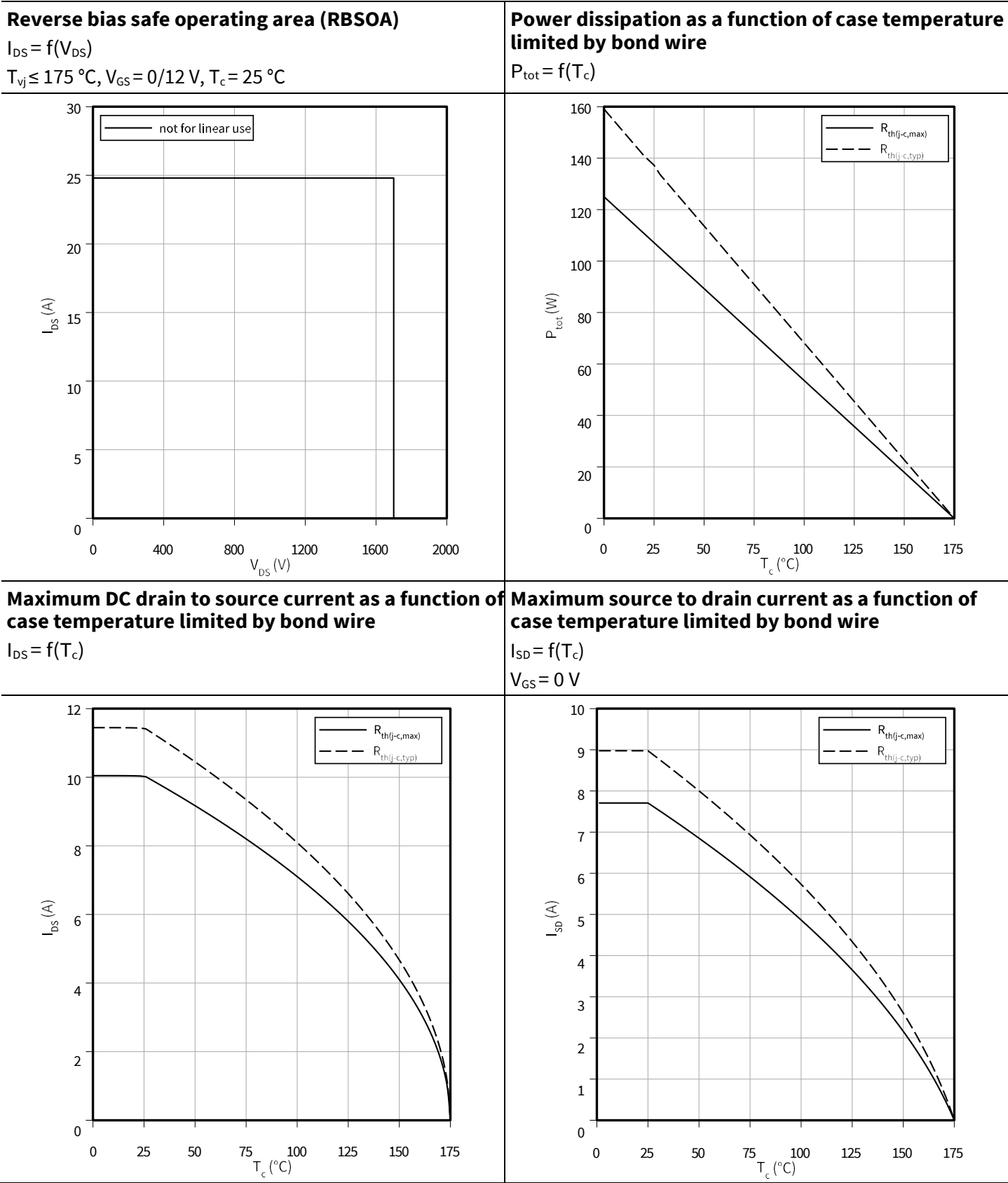
Parameter	Symbol	Note or test condition	Values	Unit
Drain-source voltage	V_{DSS}	$T_{vj} \geq 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	1700	V
Peak reverse drain current, t_p limited by $T_{vj(max)}$	I_{SM}	$V_{GS} = 0\text{ V}$	24.8	A

表6 特征值

Parameter	Symbol	Note or test condition	Values			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
Drain-source reverse voltage	V_{SD}	$I_{SD} = 2\text{ A}, V_{GS} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	3.9		V
			$T_{vj} = 175\text{ }^{\circ}\text{C}$	3.5		
MOSFET forward recovery charge	Q_{fr}	$V_{DD} = 1000\text{ V},$ $I_{SD} = 2\text{ A}, V_{GS} = 0\text{ V},$ $-di_{SD}/dt = 1000\text{ A}/\mu\text{s}, Q_{fr}$ includes also Q_c	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	62.4		nC
			$T_{vj} = 175\text{ }^{\circ}\text{C}$	93.2		
MOSFET peak forward recovery current	I_{frm}	$V_{DD} = 1000\text{ V},$ $I_{SD} = 2\text{ A}, V_{GS} = 0\text{ V},$ $-di_{SD}/dt = 1000\text{ A}/\mu\text{s}, Q_{fr}$ includes also Q_c	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	5.9		A
			$T_{vj} = 175\text{ }^{\circ}\text{C}$	6.3		
MOSFET forward recovery energy	E_{fr}	$V_{DD} = 1000\text{ V},$ $I_{SD} = 2\text{ A}, V_{GS} = 0\text{ V},$ $-di_{SD}/dt = 1000\text{ A}/\mu\text{s}, Q_{fr}$ includes also Q_c	$T_{vj} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	0.23		μJ
			$T_{vj} = 175\text{ }^{\circ}\text{C}$	0.31		
Virtual junction temperature	T_{vj}		-55		175	$^{\circ}\text{C}$

4 特征图

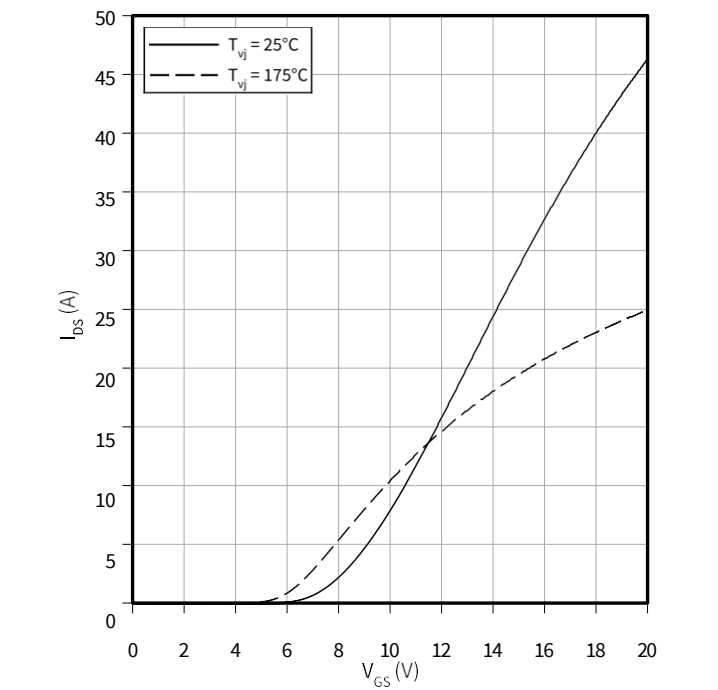
4 特性图



4 特征图

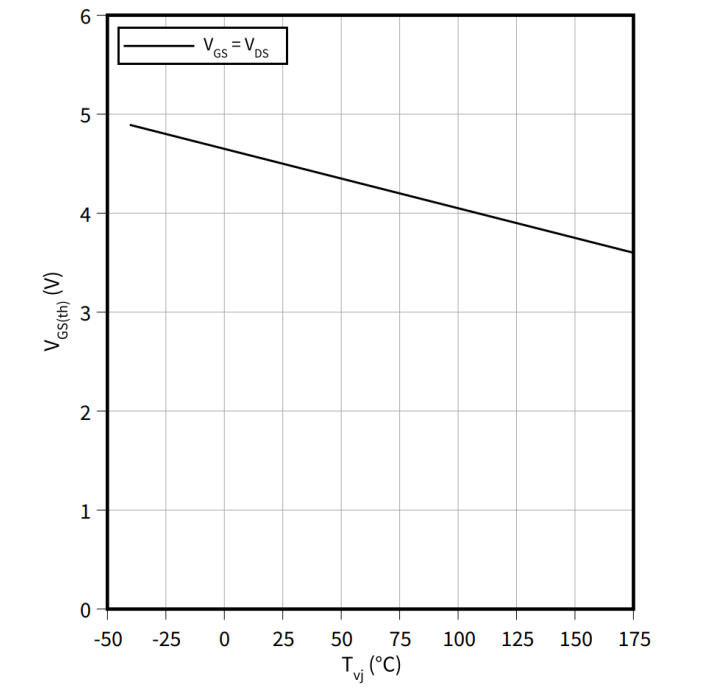
Typical transfer characteristic

$I_{DS} = f(V_{GS})$
 $V_{DS} = 20\text{ V}$, $t_p = 20\text{ }\mu\text{s}$



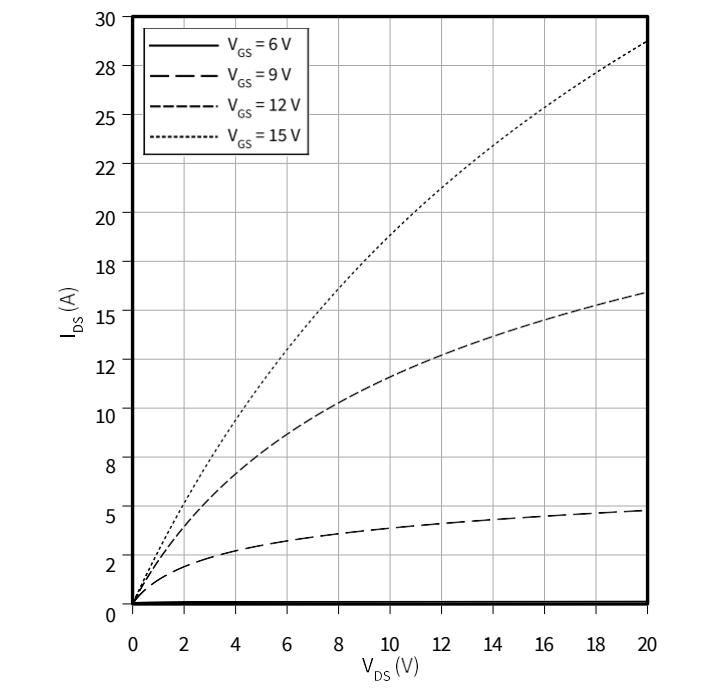
Typical gate-source threshold voltage as a function of junction temperature

$V_{GS(th)} = f(T_{vj})$
 $I_D = 2.5\text{ mA}$



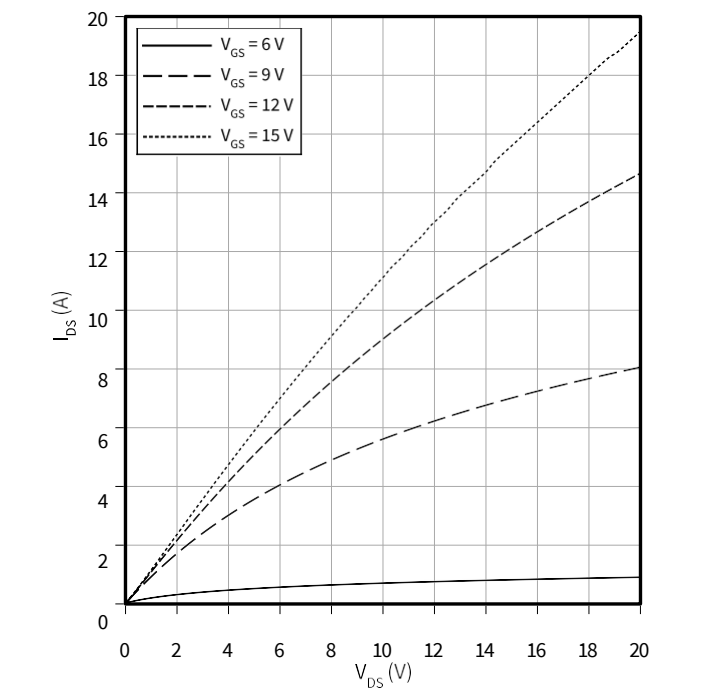
Typical output characteristic, V_{GS} as a parameter

$I_{DS} = f(V_{DS})$
 $T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$, $t_p = 20\text{ }\mu\text{s}$



Typical output characteristic, V_{GS} as a parameter

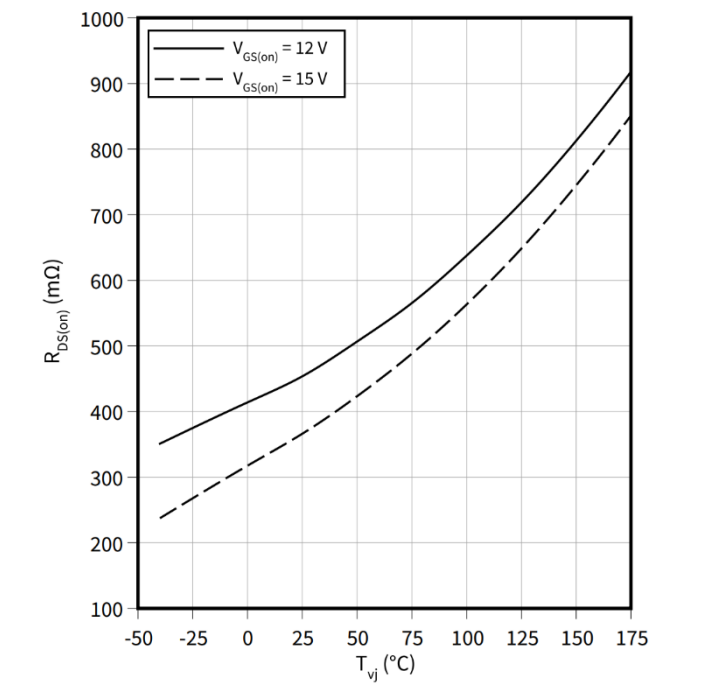
$I_{DS} = f(V_{DS})$
 $T_{vj} = 175\text{ }^\circ\text{C}$, $t_p = 20\text{ }\mu\text{s}$



4 特征图

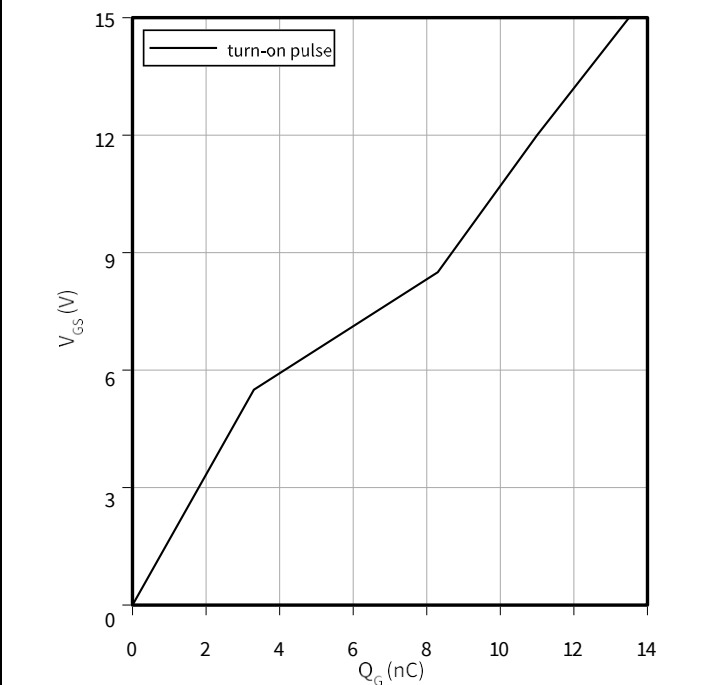
Typical on-state resistance as a function of junction temperature

$R_{DS(on)} = f(T_{vj})$
 $I_D = 2\text{ A}$



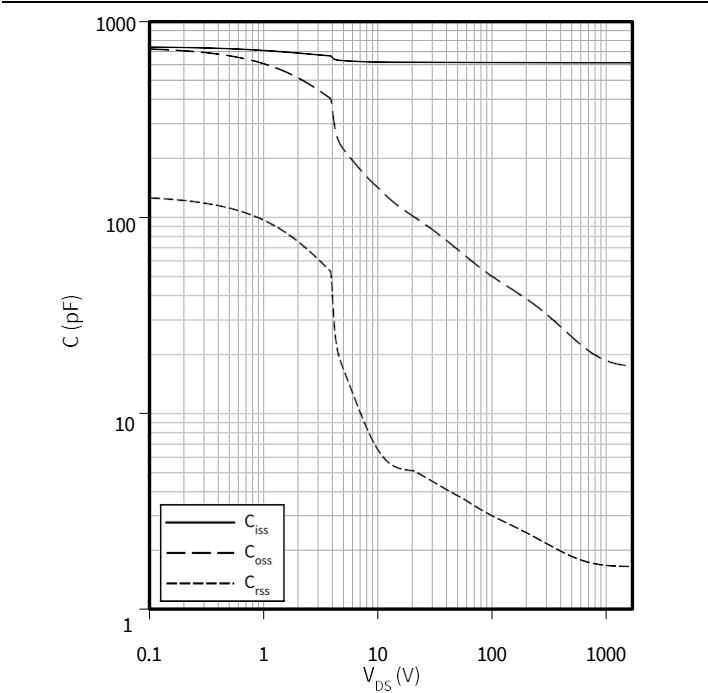
Typical gate charge

$V_{GS} = f(Q_G)$
 $I_D = 2\text{ A}, V_{DS} = 1000\text{ V}$



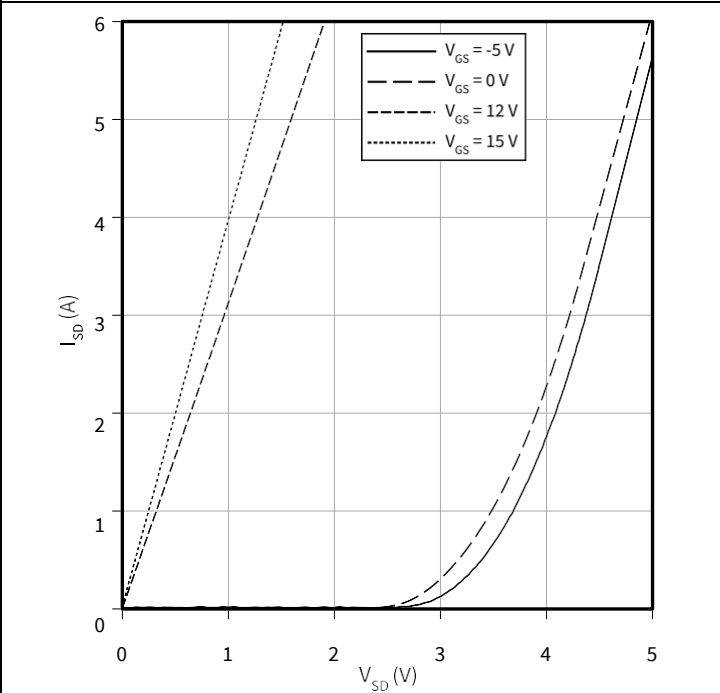
Typical capacitance as a function of drain-source voltage

$C = f(V_{DS})$
 $f = 1000\text{ kHz}, V_{GS} = 0\text{ V}$



Typical reverse drain current as a function of reverse drain voltage, V_{GS} as a parameter

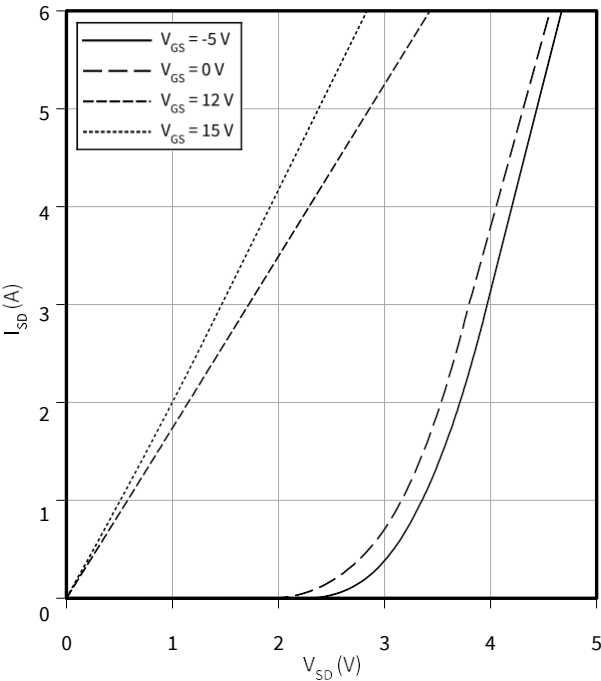
$I_{SD} = f(V_{SD})$
 $T_{vj} = 25\text{ °C}, t_p = 20\text{ }\mu\text{s}$



4 特征图

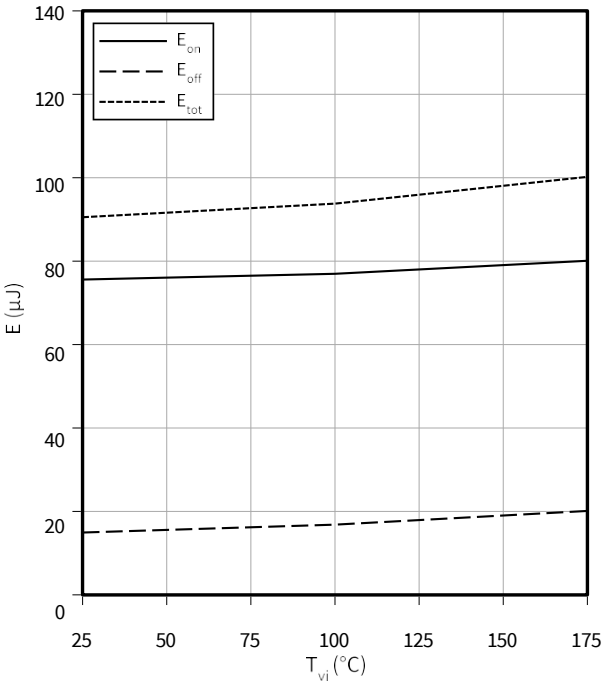
Typical reverse drain current as a function of reverse drain voltage, V_{GS} as a parameter

$I_{SD} = f(V_{SD})$
 $T_{vj} = 175\text{ }^{\circ}\text{C}$, $t_p = 20\text{ }\mu\text{s}$



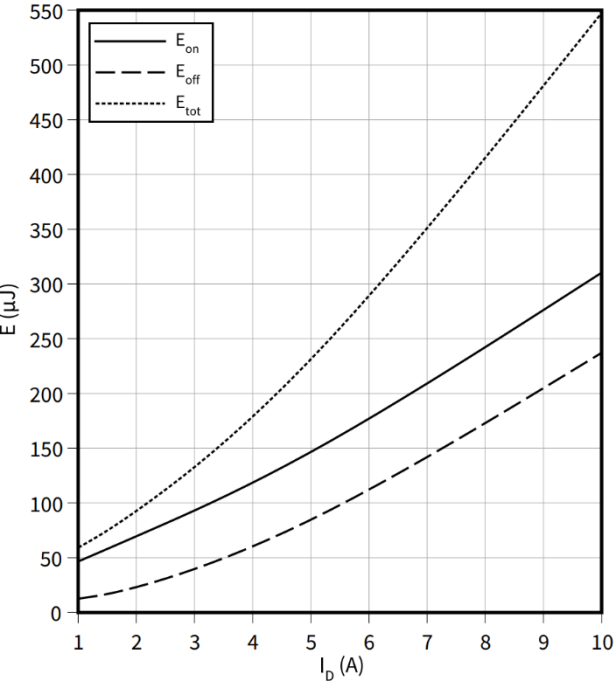
Typical switching energy as a function of junction temperature, test circuit in Fig. F, 2nd device own body diode: $V_{GS} = 0\text{ V}$

$E = f(T_{vj})$
 $V_{GS} = 0/12\text{ V}$, $I_D = 2\text{ A}$, $R_{G,ext} = 22\text{ }\Omega$, $V_{DD} = 1000\text{ V}$



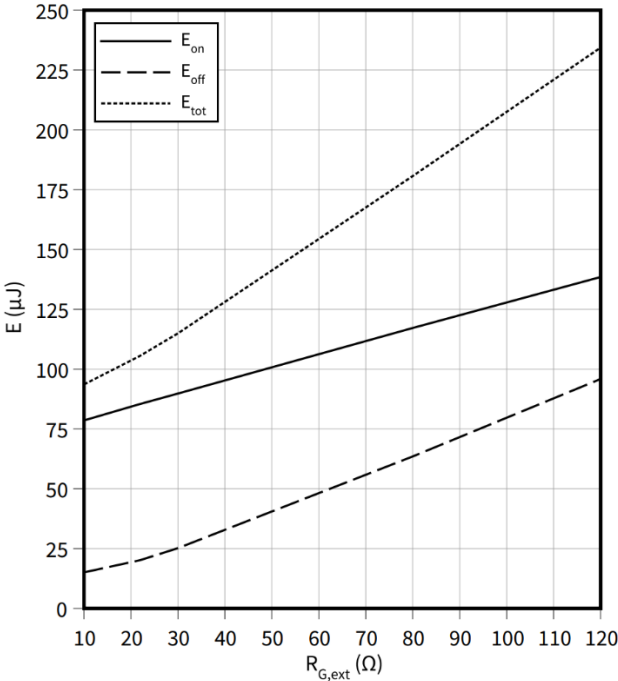
Typical switching energy as a function of drain current, test circuit in Fig. F, 2nd device own body diode: $V_{GS} = 0\text{ V}$

$E = f(I_D)$
 $V_{GS} = 0/12\text{ V}$, $T_{vj} = 175\text{ }^{\circ}\text{C}$, $R_{G,ext} = 22\text{ }\Omega$, $V_{DD} = 1000\text{ V}$



Typical switching energy as a function of gate resistance, test circuit in Fig. F, 2nd device own body diode: $V_{GS} = 0\text{ V}$

$E = f(R_{G,ext})$
 $V_{GS} = 0/12\text{ V}$, $I_D = 2\text{ A}$, $T_{vj} = 175\text{ }^{\circ}\text{C}$, $V_{DD} = 1000\text{ V}$

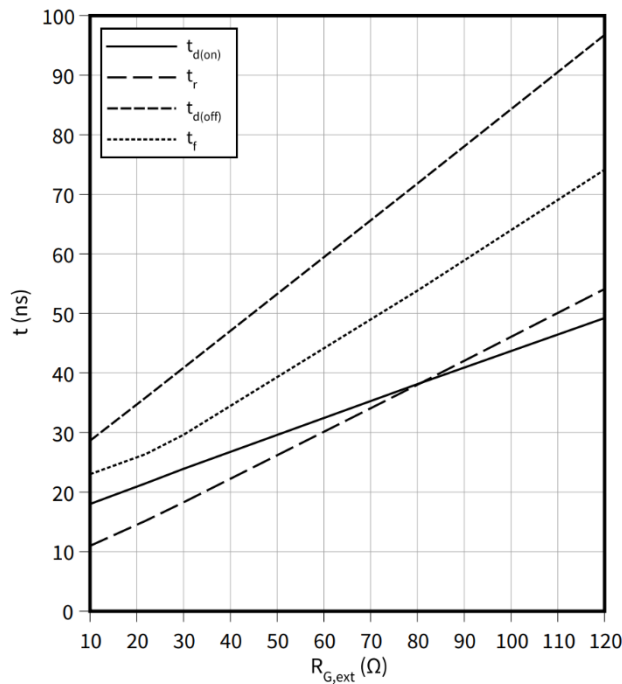


4 特征图

Typical switching times as a function of gate resistance, test circuit in Fig. F, 2nd device own body diode: $V_{GS} = 0\text{ V}$

$t = f(R_{G,ext})$

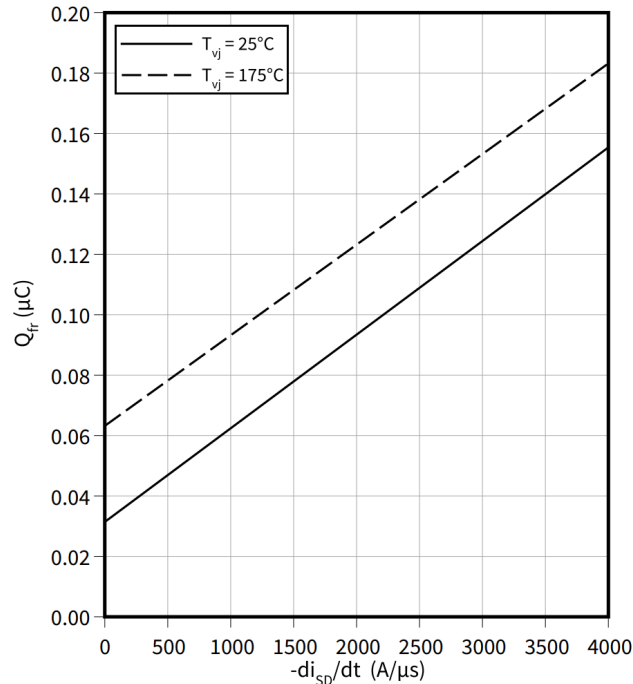
$V_{GS} = 0/12\text{ V}$, $I_D = 2\text{ A}$, $T_{vj} = 175\text{ °C}$, $V_{DD} = 1000\text{ V}$



Typical reverse recovery charge as a function of reverse drain current slope, test circuit in Fig. F, 2nd device own body diode: $V_{GS} = 0\text{ V}$

$Q_{rr} = f(-di_{SD}/dt)$

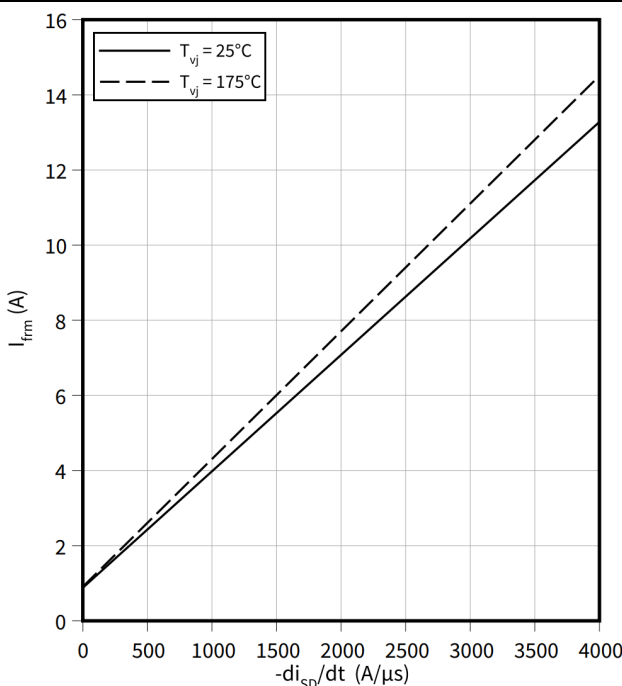
$V_{GS} = 0\text{ V}$, $I_{SD} = 2\text{ A}$, $V_{DD} = 1000\text{ V}$



Typical reverse recovery current as a function of reverse drain current slope, test circuit in Fig. F, 2nd device own body diode: $V_{GS} = 0\text{ V}$

$I_{frm} = f(-di_{SD}/dt)$

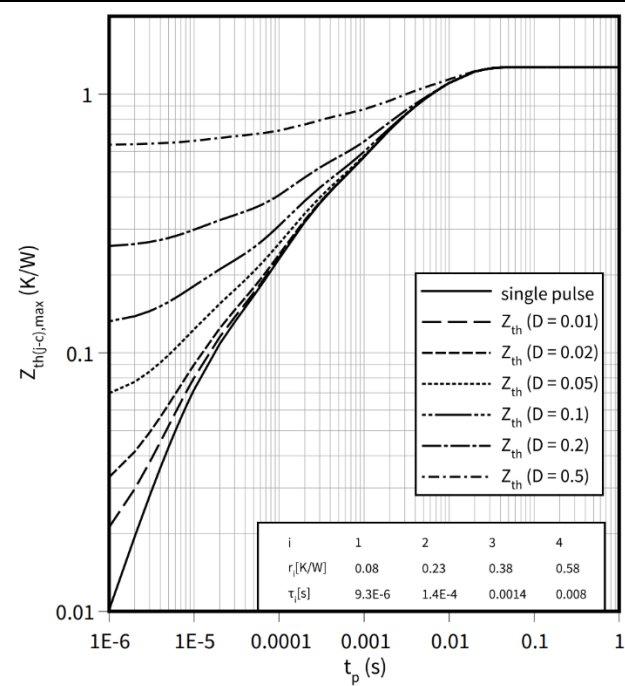
$V_{GS} = 0\text{ V}$, $I_{SD} = 2\text{ A}$, $V_{DD} = 1000\text{ V}$



Max. transient thermal impedance (MOSFET/diode)

$Z_{th(j-c),max} = f(t_p)$

$D = t_p/T$



5 封装外形

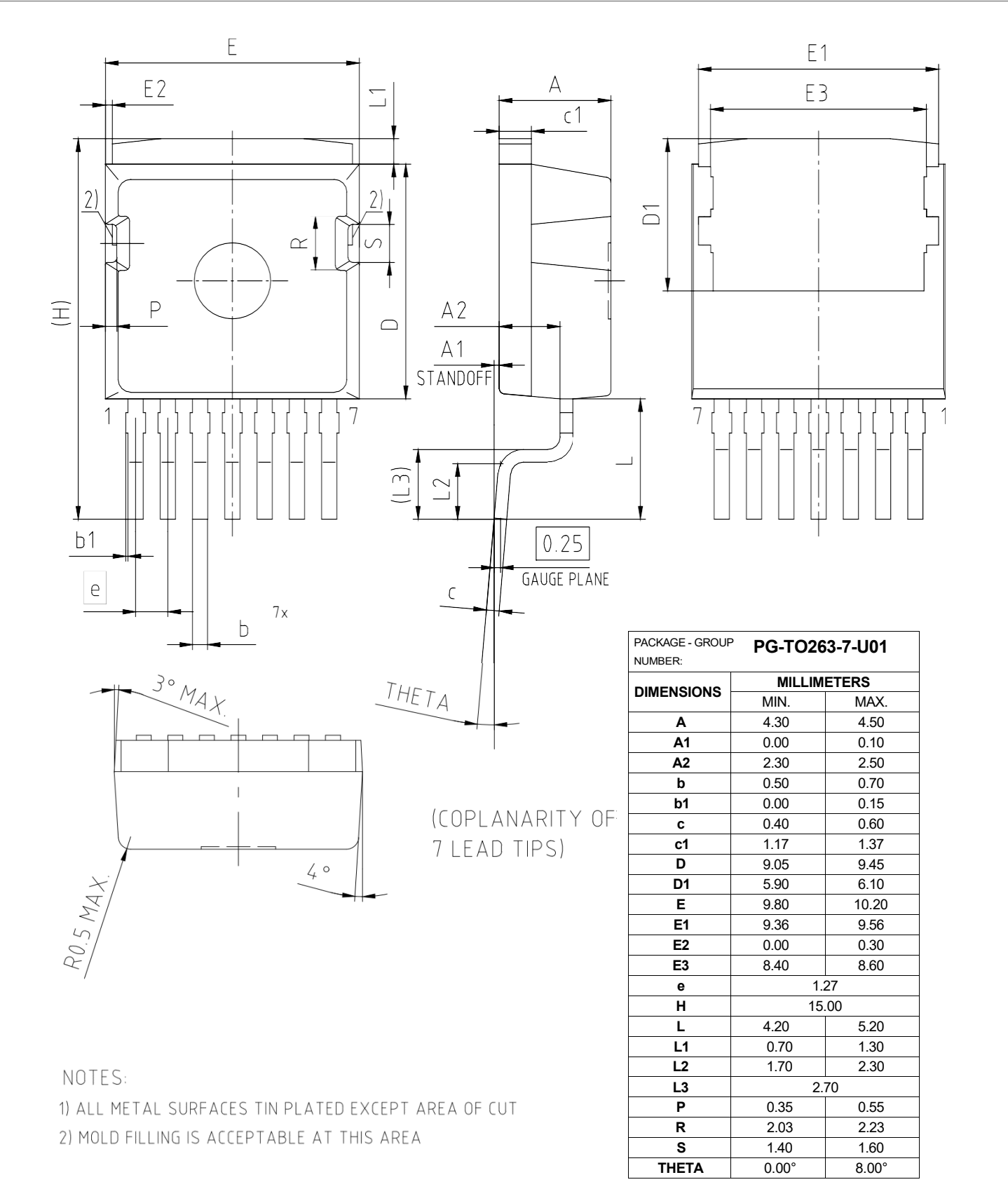


图 1

6 测试条件

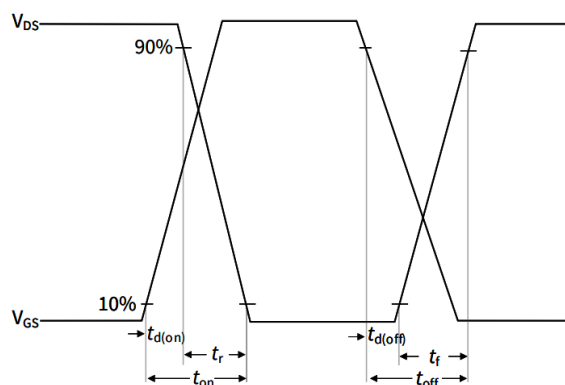


Figure A. Definition of switching times

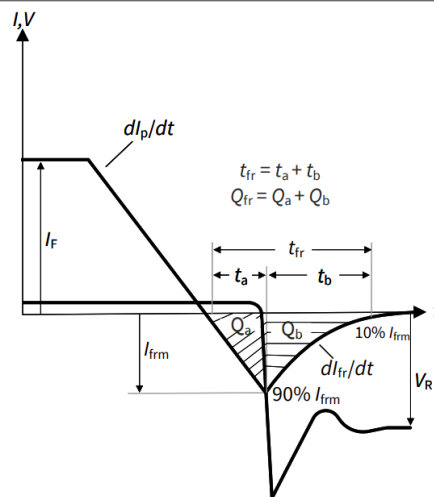


Figure B. Definition of diode switching characteristics

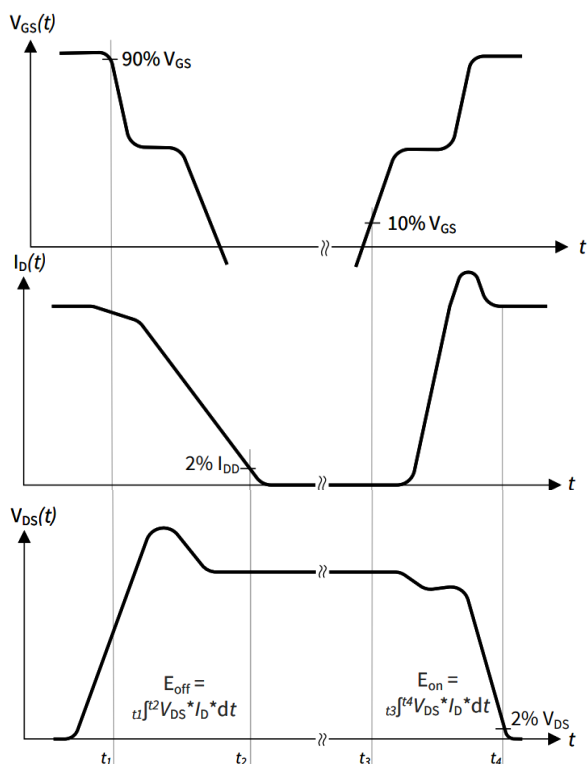


Figure C. Definition of switching losses

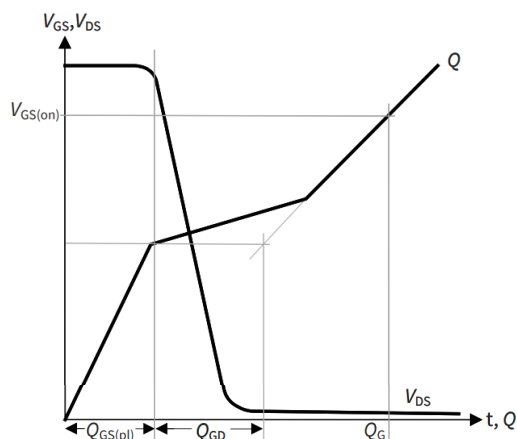


Figure D. Definition of QGD

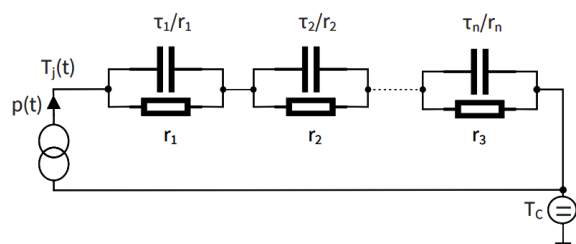


Figure E. Thermal equivalent circuit

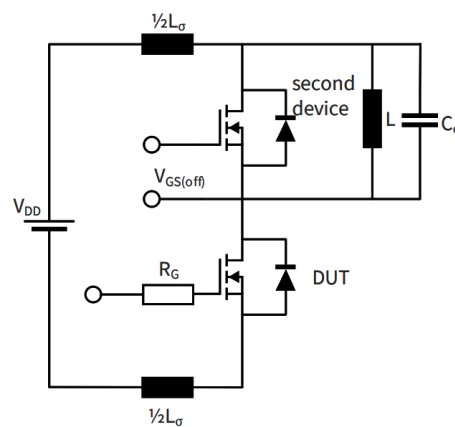


Figure F. Dynamic test circuit
Parasitic inductance L_{σ} ,
Parasitic capacitor C_{σ} ,

修订记录

修订记录

Document revision	Date of release	Description of changes
1.00	2025-03-22	Changed package name Increased Gate-source voltage, max. transient voltage Added Gate-source voltage, max. static voltage Added diode characteristic parameters in Table 5 and Table 6 Corrected legend of diagram $R_{DS(on)} = f(T_{vj})$ Added graphs $I_{SD} = f(V_{SD})$, $I_{SD} = f(T_c)$, $Q_{fr} = f(-di_{SD}/dt)$, $I_{frm} = f(-di_{SD}/dt)$ Corrected graph $I_{DS} = f(T_c)$ Editorial changes ***Legacy Revisions*** 2.1 2020-04-27 Final Datasheet 2.2 2020-12-11 Correction of circuit symbol on page 1 2.3 2021-04-12 Editorial changes



免责声明

请注意，本文件的原文使用英文撰写，为方便客户浏览英飞凌提供了中文译文。该中文译文仅供参考，并不可作为任何论点之依据。

由于翻译过程中可能使用了自动化程序，以及语言翻译和转换过程中的差异，最后的中文译文与最新的英文版本原文含义可能存在不尽相同之处。

因此，我们同时提供该中文译文版本的最新英文原文供您阅读，请参见 <http://www.infineon.com>

英文原文和中文译文版本之间若存有任何歧异，以最新的英文版本为准，并且仅认可英文版本为正式文件。

您如果使用本文件，即表示您同意并理解上述说明。英飞凌不对因翻译过程中可能存在的任何不完整或不准确信息而产生的任何直接或间接损失或损害负责。英飞凌不承担中文译文版本的完整性和准确性责任。如果您不同意上述说明，请不要使用本文件。

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

重要通知

版本 2025-12-24

Infineon Technologies AG 出版，
德国 Neubiberg 85579

版权 © 2025 Infineon Technologies AG
及其关联公司。
保留所有权利。

Do you have a question about this
document?

Email:
erratum@infineon.com

Infineon Technologies AG 及其关联公司（以下简称“英飞凌”）销售或提供和交付的产品（可能也包括样品，且可能由硬件或软件或两者组成）（以下简称“产品”），应遵守客户与英飞凌签订的框架供应合同或其他书面协议的条款和条件，如无上述合同或其他书面协议，则应遵守适用的英飞凌销售条件。只有在英飞凌明确书面同意的情况下，客户的一般条款和条件或对适用的英飞凌销售条件的偏离才对英飞凌具有约束力。

为避免疑义，英飞凌不承担侵犯第三方权利的所有保证和默示保证，例如对特定用途/目的的适用性或适销性的保证。

英飞凌对与样品、应用或客户对任何产品的具体使用有关的任何信息或本文件中给出的任何示例或典型值概不负责。

本文件中包含的数据仅供具有技术资格和技能的客户代表使用。客户有责任评估产品对预期应用和客户特定用途的适用性，并在预期应用和客户特定用途中验证本文件中包含的所有相关技术数据。客户有责任正确设计、编程和测试预期应用的功能性和安全性，并遵守与其使用相关的法律要求。

除非英飞凌另行明确批准，否则产品不得用于任何因产品故障或使用产品的任何后果可合理预期会导致人身伤害的应用。但是，上述规定并不妨碍客户在英飞凌明确设计和销售的使用领域中使用任何产品，但是客户对应用负有全部责任。

英飞凌明确保留根据适用法律，如《德国版权法》（UrhG）第 44b 条，将其内容用于商业资料和数据探勘（TDM）的权利。

如果产品包含安全功能：

由于任何计算设备都不可能绝对安全，尽管产品采取了安全措施，但英飞凌不保证产品不会被入侵、数据不会被盗或遗失，或不会发生其他漏洞（以下简称“安全漏洞”），英飞凌对任何安全漏洞不承担任何责任。

如果本文件包含或引用软件：

根据美国、德国和世界其他国家的知识产权法律和条约，该软件归英飞凌所有。英飞凌保留所有权利。因此，您只能按照软件附带的软件授权协议的规定使用本软件。

如果没有适用的软件授权协议，英飞凌特此授予您个人的、非排他性的、不可转让的软件知识产权授权（无权转授权）：(a) 对于以源代码形式提供的软件，仅在贵组织内部修改和复制该软件用于英飞凌硬件产品；及 (b) 对于以二进制代码 (binary code) 形式对外向终端用户分发该软件，仅得用于英飞凌硬件产品。禁止对本软件进行任何其他使用、复制、修改、翻译或编译。有关产品、技术、交货条款和条件以及价格的详细信息，请联系离您最近的英飞凌办公室或访问 <https://www.infineon.com>。